27B/2010G047

イメージング XAFS 法による土壌および鉱物試料中のセシウム観察 Imaging XAFS analysis of Cs in soil and clay minerals

岡本芳浩^{1*},中田正美、赤堀光雄、大杉武史、中塩信行 ¹日本原子力研究開発機構、〒319-1195 茨城県那珂郡東海村白方白根 2-4

1 はじめに

福島第一原子力発電所の事故以来、環境中の放射 性セシウムの除去が大きな課題になっている。中で も、土壤などに強く固着したセシウムは、その効果 的な除染法の確立が急がれている。土壌のように複 雑な多成分系試料中のセシウムの化学状態を把握す るために、元素選択性に優れた放射光 XAFS 分析法 を用いる意義は大きい。

本研究では、土壌中の粘土鉱物に吸着したセシウ ムの分布と化学状態を調べるために、イメージング XAFS 分析法の適用を試みた。

2 <u>実験</u>

イメージング XAFS 測定は、BL-27B ステーショ ンにおいて、セシウムの L_3 吸収端 ($E_0=5.012$ keV) を使用して実施した。図1に示すように、通常の透 過法 XAFS 測定のレイアウトから、下流のイオンチ ェンバーをイメージング測定機器に置き換えただけ である[1]。



試料は、土壌に非放射性のセシウムを吸着させた ものを用いた。硝酸セシウム水溶液中に浸漬した土 壌を、洗浄・乾燥した上で測定試料とした。

3 <u>結果および考察</u>

イメージング XAFS 試験に先立って、通常の XAFS 測定を実施した。土壌試料中のセシウムの含 有量は、酸化物換算で 0.5~1.0%程度であり、蛍光法 による測定が最適である。しかし、実際には鉱物中 にわずかながら含まれるチタンの Ka線による影響 で、有意な XAFS スペクトルの取得はできなかった で。一方、透過法によりセシウムの L₃吸収端 XAFS スペクトルが取得できたが、チタンの K 吸収端 (E₀=4.966keV) が近くにあり、その影響が無視で きない。つまり、チタンによる EXAFS 振動が、セ シウムの XAFS 領域に重なる。

図2に、土壌試料中のイメージング XAFS 試験の 結果から得られたセシウムの分布を示す。試料中の 特定の領域に集中して分布している。これは、同時 に調べたチタンの分布とは異なっていた。

そこで、図2の中のセシウム濃度の高い微小領域 (図中の着目領域で、約50µm四方が対象)につい てXAFS スペクトルを導出した。その結果を図3に 示す。



図3 着目領域のイメージング XAFS スペクトル

4 <u>まとめ</u>

土壌試料中のセシウムのイメージング XAFS 試験 を行い、セシウムの分布を明らかにするとともに、 微小領域の XAFS スペクトルを導出した。

参考文献

- Y.Okamoto et al., Adv. X-ray Chem. Anal. 42, 183 (2011).
- * okamoto.yoshihiro@jaea.go.jp